



 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	SN74BCT8374ADWR	
	Hersteller-Teilenummer:	SN74BCT8374ADWR
	Hersteller / Marke:	N/A
	Teil der Beschreibung:	IC SCAN TEST DEVICE W/FF 24-SOIC
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 2549 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	SN74BCT8374ADWR
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC SCAN TEST DEVICE W/FF 24-SOIC
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Logik - Speziallogik
Teilstatus	2549 pcs Stock
Versorgungsspannung	4.5 V ~ 5.5 V
Supplier Device-Gehäuse	24-SOIC
Serie	74BCT
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	24-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C
Anzahl der Bits	8
Befestigungsart	Surface Mount
Logiktyp	Scan Test Device with D-Type Edge-Triggered Flip-Flops

SN74BCT8374ADWR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SN74BCT8374ADWR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SN74BCT8374ADWR mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SN74BCT8374ADWR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>SN74BCT8374ANT N/A IC SCAN TEST DEVICE W/FF 24-DIP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>SN74BCT8373ANT N/A IC SCAN TEST DEVICE LATCH 24-DIP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>SN74BCT8374ANTG4 N/A IC SCAN TEST DEVICE W/FF 24-DIP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>SN74BCT8373ADWRE4 N/A IC SCAN TEST DEVICE LATCH 24SOIC</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>SN74BCT8374ADWRG4 N/A IC SCAN TEST DEVICE 24SOIC</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>SN74BCT899DWR TI SN74BCT899DWR TI</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>SN74BCT8374ADW N/A IC SCAN TEST DEVICE W/FF 24-SOIC</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>SN74BCT8373ADWRG4 N/A IC SCAN TEST DEVICE 24SOIC</p>

SN74BCT8374ADWR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SN74BCT8374ADWR Datenblatt	SN74BCT8374ADWR-Datenblätter	SN74BCT8374ADWR PDF	SN74BCT8374ADWR
SN74BCT8374ADWR Electronic	SN74BCT8374ADWR-Komponenten	SN74BCT8374ADWR-Bild	SN74BCT8374ADWR-Teil
SN74BCT8374ADWR Preis	SN74BCT8374ADWR Hersteller	SN74BCT8374ADWR Aktie	SN74BCT8374ADWR Inventar
SN74BCT8374ADWR Neu	SN74BCT8374ADWR Original	SN74BCT8374ADWR RFQ	SN74BCT8374ADWR Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited